

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 15 日 (15.09.2005)

PCT

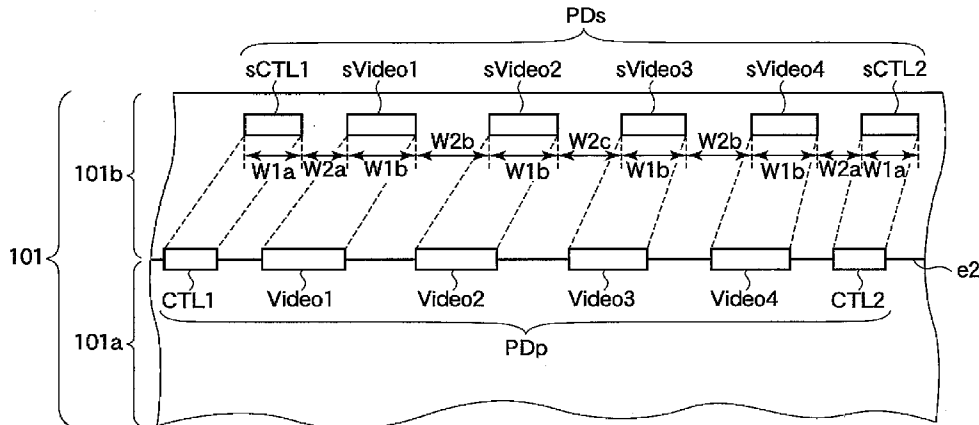
(10) 国際公開番号
WO 2005/085939 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G02F 1/13, 1/1345, G01R 31/00, G09F 9/30
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002816
- (22) 国際出願日: 2005 年 2 月 22 日 (22.02.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-059275 2004 年 3 月 3 日 (03.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 (TOSHIBA MATSUSHITA DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南四丁目 1 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 山本 光浩 (YAMAMOTO, Mitsuhiro) [JP/JP]. 宮武 正樹 (MIYATAKE, Masaki) [JP/JP].
- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴榮特許総合事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続 葉 有]

(54) Title: ARRAY BOARD INSPECTING METHOD

(54) 発明の名称: アレイ基板の検査方法



(57) Abstract: An array board is provided with a board on which a plurality of scanning lines and a plurality of signal lines cross, a pixel part, which is formed on the board in the vicinity of the crossing part and includes a switching element and an auxiliary capacitor, and a plurality of inspection pad rows, which are connected with the scanning lines and the signal lines and arranged in accordance with probe arrangement of inspecting equipment. After accumulating charges in the auxiliary capacitor of each pixel part by connecting the probe with the inspecting pad rows, the conditions of the array board are inspected.

(57) 要約: 複数の走査線および複数の信号線が交差して配置された基板と、この基板上に形成され、走査線および信号線の交差点近傍に配置されており、スイッチング素子および補助容量を含む画素部と、走査線および信号線と接続され、かつ、検査装置のプロープの配置に合わせて配置された複数の検査パッド列と、を有したアレイ基板を用意する。プロープを前記検査パッド列に接続して各画素部の補助容量に電荷を蓄積した後、アレイ基板の状態を検査する。



WO 2005/085939 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書